УДК 539.3

ВОЛНОВЫЕ ПОЛЯ И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЗОНЫ В КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИХ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТАХ¹ Фоменко С. И.²

WAVEFIELDS AND BAND-GAPS IN LAYERED QUASI-PERIODICAL COMPOSITES Fomenko S. I.

Elastic wave propagation in periodically layered composites is under investigation. Wave motion is excited by an incident plane P- or SV- wave. Wavefield is constructed via T-matrix method including explicit singular values of T-matrix. The dependencies of band-gap on layer's thicknesses, type of incident wave and angle of incidence are shown.

Keywords: elastic waves, phononic crystal, T-matrix, stop-band, low transmission passband.

Введение

Современные композитные многослойные структуры нашли широкое применение во многих областях промышленности благодаря тому, что обладают порой уникальными, не встречающимися в природе свойствами, которые возникают из-за особого сочетания материалов, входящих в их состав. Состав композитного материала может быть очень разнообразным, структура — обычно периодическая или стохастическая со специальными свойствами.

К классу композитных материалов относятся и так называемые фононные кристаллы. Они схожи с фотонными кристаллами тем, что состоят из периодических включений в матрицу или слои, но, в отличие от последних, фононные кристаллы являются каналами для распространения и фильтрации акустических или упругих колебаний. Концепция фононных кристаллов появилась в 1990-х годах, являясь во-многом продолжением работ по фотонным кристаллам [1]. Подобно фотонным, фононные кристаллы обладают такими же особыми частотными характеристиками, как запрещенные частотные зоны. В запрещенной зоне распростране-

ние волн через кристалл фактически невозможно. Это явление может быть использовано в широком спектре технологий. Приложения включают в себя упругую или акустическую фокусировку, минимизацию вибрации, звуковую коллимацию, акустическую маскировку, опто-механические преобразования волн в фотонных устройствах, снижение теплопроводности в полупроводниках и др. [2]. Фононные кристаллы могут быть использованы как эффективные звуковые изоляторы для вибрирующих структур, гироскопы или механические резонаторы. Среди фононных кристаллов можно выделить акустические фононные кристаллы с матрицей из жидкости, упругие фононные кристаллы с матрицей сплошного упругого вещества, пьезоэлектрические и магнонные кристаллы [3]. Кроме того, выделяют одномерные фононные кристаллы, в которых упругие свойства изменяются периодически только в одном направлении, а также двух- и трехмерные периодические структуры [4].

Для решения задач распространения волн в многослойных средах, примером которых является фононный кристалл, разрабатываются и развиваются различные численные методы, такие как расширенный метод

¹Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (№12–01–33011 мол-вед-а и № 13-01-96520 р_юг_а), а также в рамках проекта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (14.В37.21.0387)

 $^{^2 \}Phi$ оменко Сергей Иванович, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института математики, механики и информатики Кубанского государственного университета; e-mail: sfom@yandex.ru.



Рис. 1. Постановка задачи

плоских волн [5], метод Т-матриц [6], метод ек $(a_{i-1} \leq z \leq a_i)$, расположенных между конечных разностей [7], метод граничных интегральных уравнений [8], динамический метод конечных элементов [9] и др.

Наряду с указанными для многослойных сред разработаны методы, основанные на интегральном подходе [10, 11]. Конструкция символа Фурье матрицы Грина и техника поиска полюсов и вычетов в них позволяет вывести асимптотику для волновых полей в дальней зоне [12], что играет ключевую роль в определении динамической реакции материала и в исследовании волновых полей. В отличие от представления классического модального анализа, последний может учитывать не только характеристики материала, но и источника. Асимптотическое представление удобно как для модального, так и для амплитудного анализа. Это становится эффективным инструментом для быстрого параметрического анализа в случае, если имеется достаточно надежный алгоритм для построения матрицы Грина, поиска полюсов и расчета вычетов.

Целью работы является развитие метода моделирования волновых колебаний в периодических слоистых и функциональноградиентных материалах (фононных кристаллов) на основе интегрального подхода и метода Т-матриц, анализ фильтрационных свойств (запрещенных зон) и влияние на них свойств материалов, образующих ячейку кристалла. Она является естественным продолжением работ, начатых в [13].

1. Одномерный фононный кристалл

В фононном кристалле (ФнК), состоящем из N периодически повторяющихся яче-

двумя упругими полупространствами HS_A и HS_B (рис. 1), приходящей из плоскости z < 0 волной $\mathbf{u}_{inc}(x,z) \exp(-i\omega t)$ возбуждаются гармонические колебания на частоте ω . Рассматриваются *P*- и *SV*-волны.

Каждая ячейка представляет собой набор из двух однородных изотропных слоев толщины h_A и h_B соответственно, толщина ячейки $H = h_A + h_B$. Таким образом, квазипериодическая структура (ФнК) состоит из N ячеек, занимающих последовательно области $a_{k-1} \leq z \leq a_k$ $(k = 1, 2, \dots, N)$. Весь ФнК расположен в пределах $0 \leq z \leq NH$.

Вектор перемещений

$$\mathbf{u} = \{u_x, u_z\} = \{u_1, u_2\}$$

может быть представлен через потенциалы продольных φ и поперечных ψ колебаний

$$u_1 = \partial \varphi / \partial z + \partial \psi / \partial x, \quad u_2 = \partial \varphi / \partial x - \partial \psi / \partial z,$$

удовлетворяющие волновым уравнениям

$$\Delta \varphi - \frac{1}{v_P^2} \ddot{\varphi} = 0, \quad \Delta \psi - \frac{1}{v_S^2} \ddot{\psi} = 0.$$
(1.1)

Здесь $v_P = \sqrt{(\lambda + 2\mu)/\rho}$ и $v_S = \sqrt{\mu/\rho}$ скорости продольных и поперечных колебаний слоя с плотностью ρ и модулями Ламе λ и μ . Тензор напряжений имеет вид $\sigma_{ij} = \lambda \, u_{k,k} \, \delta_{i,j} + \mu (u_{i,j} + u_{j,i}).$

На границах слоев $z = z_n$ (n = 1, 2, ..., N)заданы условия непрерывности перемещений и нормальных к границе напряжений, в качестве условия на бесконечности $(|z| \rightarrow \infty)$ принимается принцип предельного поглощения.

2. Математическая модель колебаний фононного кристалла

2.1. Плоские колебания фононного кристалла

С помощью преобразования Фурье \mathcal{F}_x по координате x с параметром α решение представляется в виде суперпозиции плоских волн, каждая из которых является решением задачи для падающей плоской волны $\mathbf{U}_{inc}(z,\alpha) \exp(i\alpha x - i\omega t)$, где $\mathbf{U}_{inc} = \mathcal{F}_x[\mathbf{u}_{inc}]$ — преобразование Фурье вектора \mathbf{u}_{inc} .

Тогда потенциалы для задачи с плоскими колебаниями имеют вид

$$\Phi(z, \alpha) \exp(i\alpha x - i\omega t)$$
 и $\Psi(z, \alpha) \exp(i\alpha x - i\omega t)$.

Здесь Φ и Ψ — комплексные амплитуды потенциалов, являющиеся преобразованиями Фурье потенциалов φ и ψ соответственно, имеют следующее общее представление:

$$\Phi = a_1 e^{iq_L z} + a_3 e^{-iq_L z},
\Psi = a_2 e^{iq_T z} + a_4 e^{-iq_T z},$$
(2.1)

где $q_L = \varkappa_L \cos \theta_L$ и $q_T = \varkappa_T \cos \theta_T$. В последних соотношениях использованы обозначения: $\varkappa_L = \omega/v_P$, $\varkappa_T = \omega/v_S$ — волновые числа *P*- и *S*-волны в рассматриваемой среде, а углы θ_L и θ_T определяются из уравнений

$$\varkappa_L \sin \theta_L = \varkappa_T \sin \theta_T = \alpha$$

В общем случае θ_{Lk} и θ_{Tk} — комплексные многолистные функции α . Правильный лист следует выбрать, используя один из принципов излучения. Принцип предельного поглощения приводит к следующим необходимым условиям:

$$\operatorname{Re}[\cos \theta_s] \ge 0, \quad \operatorname{Im}[\cos \theta_s] \ge 0, \quad s = L, T.$$

2.2. Метод Т-матриц и сингулярные числа Т-матрицы ячейки

Коэффициенты прохождения и отражения для многослойного ФнК определяются из условий непрерывности напряжений и смещений на интерфейсах слоев. Для этой цели может быть использован метод матриц переноса (Т-матриц) [14], где общая матрица переноса всей структуры из N-ячеек находится как степень $\mathbf{T} = \mathbf{T}_c^N$ матрицы переноса одной ячейки \mathbf{T}_c . В предположении, что ячейка кристалла состоит из L слоев ее матрица $\mathbf{T}_c = \mathbf{T}_L \cdot \mathbf{T}_{L-1} \cdot \ldots \cdot \mathbf{T}_2 \cdot \mathbf{T}_1$ — произведение Т-матриц каждого слоя (нумерация слоев — в направлении падающей волны).

Матрица переноса \mathbf{T}_k произвольного слоя $z_{k-1} < z < z_k$ с номером k выражает линейную зависимость между характеристиками произвольной точки поля и его значениями на границе

$$\mathbf{v}(z) = \mathbf{T}_k(z, z_{k-1})\mathbf{v}(z_{k-1}). \qquad (2.2)$$

Здесь $\mathbf{v} = \{U_1, U_2, \Sigma_{12}, \Sigma_{22}\}^T$ — обобщенный вектор-столбец, сформированный из преобразований Фурье компонент комплексных амплитуд смещений **u** и горизонтальных напряжений $\boldsymbol{\sigma}_z = \{\sigma_{12}, \sigma_{22}\}$. Матрица \mathbf{T}_k может быть найдена следующим образом:

$$\mathbf{T}_k(z, z_{k-1}) = \mathbf{M}_k \mathbf{E}_k(z - z_{k-1}) \mathbf{M}_k^{-1}.$$

Здесь \mathbf{M}_k — состоящая из 4х вектор-столбцов следующая матрица:

$$\mathbf{M}_{k} = \left(\mathbf{b}_{1}^{+} \vdots \mathbf{b}_{2}^{+} \vdots \mathbf{b}_{1}^{-} \vdots \mathbf{b}_{2}^{-}\right), \qquad (2.3)$$

$$\mathbf{b}_{1}^{\pm} = \{i\varkappa_{L\,k}\sin\theta_{L\,k}, \pm i\varkappa_{L\,k}\cos\theta_{L\,k}, \\ \mp \mu_{k}\varkappa_{L\,k}^{2}\sin2\theta_{L\,k}, \quad -\mu_{k}\varkappa_{T\,k}^{2}\cos2\theta_{T\,k}\}^{\mathrm{T}},$$

$$\mathbf{b}_{2}^{\pm} = \{\pm i \varkappa_{T\,k} \cos \theta_{T\,k}, \ -i \varkappa_{T\,k} \sin \theta_{T\,k}, \\ -\mu_{k} \varkappa_{T\,k}^{2} \cos 2\theta_{T\,k}, \ \pm\mu_{k} \varkappa_{T\,k}^{2} \sin 2\theta_{T\,k}\}^{\mathrm{T}},$$

где символ \mathbf{a}^{T} обозначает, как обычно, операцию транспонирования;

$$\mathbf{E}_{k}(z) = \operatorname{diag}\{\exp[i q_{Lk} z], \exp[i q_{Tk} z], \\ \exp[-i q_{Lk} z], exp[-i q_{Tk} z]\}$$

 — диагональная матрица перечисленных экспонент.

Используя базис Жордана матрицы перехода ячейки \mathbf{T}_c , общая Т-матрица ФнК находится как произведение

$$\mathbf{\Gamma} = \mathbf{G}^{-1} \, \mathbf{\Lambda}^N \, \mathbf{G},$$

где **G** — матрица перехода **T**_c к диагональной матрице Жордана **A** = diag{ $1/\lambda_1$, $1/\lambda_2, \lambda_1, \lambda_2$ }, за исключением очень редких и специфических случаев, когда $\lambda_1 = \lambda_2$ и матрица Жордана может иметь треугольный вид.

Пусть $\{r_L, t_L\}$ и $\{r_T, t_T\}$ — амплитудные коэффициенты отраженных и прошедших *P*и *SV*-волн в полуплоскостях рассматриваемой периодической структуры соответственно. Тогда обобщенные вектор **v** в нижней и верхней полуплоскости имеют соответствующий вид:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_{inc} + r_L \mathbf{v}_{L0}^- + r_T \mathbf{v}_{T0}^- =$$

= $\mathbf{M}^- \mathbf{E}^-(z) \mathbf{h}^-, \quad z \leq 0,$
$$\mathbf{v} = t_L \mathbf{v}_{LN}^+ + t_T \mathbf{v}_{TN}^+ =$$

= $\mathbf{M}^+ \mathbf{E}^+(z) \mathbf{h}^+, \quad z \geq NH.$
(2.4)

Здесь \mathbf{v}_{inc} — обобщенный вектор падающего поля, вектора $\mathbf{h}^- = \{\delta_L, \delta_T, r_L, r_T\}$ и $\mathbf{h}^+ = \{t_L, t_T, 0, 0\}$ составлены из известных амплитудных коэффициентов падающей волны δ_L и δ_T и неизвестных амплитудных коэффициентов отраженной и прошедшей волн; \mathbf{M}^- и \mathbf{M}^+ — М-матрицы (2.3) нижней и верхней полуплоскости соответственно.

Выделение сингулярных составляющих в решении, вносимых матрицей Λ^N , позволяет получить полуаналитическое представление для коэффициентов прохождения

$$\{t_L, t_T\} = \sum_{i=1}^{4} \mathbf{m}_i \lambda_i^N / \Delta,$$

$$\Delta = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=i+1}^{4} \Delta_{ij} \lambda_i^N \lambda_j^N,$$

(2.5)

где собственные значения $\lambda_3 = 1/\lambda_1$ и $\lambda_4 = 1/\lambda_2$, а векторы \mathbf{m}_i и коэффициенты Δ_{ij} (i, j = 1, 2, 3, 4) выражаются через элементы матриц $\|d_{ij}\| = \mathbf{M}_{-}^{-1}\mathbf{G}^{-1}$ и $\|e_{ij}\| = \mathbf{GM}_{+}$:

$$\mathbf{m}_{i} = (d_{2i}\delta_{L} - d_{1i}\delta_{T})\{e_{i2}, -e_{i1}\};$$

$$\Delta_{ij} = \begin{vmatrix} d_{1i} & d_{1j} \\ d_{2i} & d_{2j} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} e_{i1} & e_{i2} \\ e_{j1} & e_{j2} \end{vmatrix}.$$

Амплитудные коэффициенты отраженных волн

$$\{r_L, r_T\} = \sum_{j=1}^3 \sum_{k=j+1}^4 \mathbf{s}_{jk} \,\lambda_j^N \lambda_k^N / \Delta \qquad (2.6)$$

могут быть выражены через компоненты векторов $\mathbf{s}_{jk} = \{s_{1jk}, s_{2jk}\}$

$$s_{ijk} = (e_{j1}e_{k2} - e_{j2}e_{k1}) \times \\ \times \left[(d_{i+2 \ j} \ d_{2k} - d_{i+2 \ k} \ d_{2j}) \delta_L \\ - (d_{i+2 \ j} \ d_{1k} - d_{i+2 \ k} \ d_{1j}) \delta_T \right],$$

$$i = 1, 2; \ j, k = 1, 2, 3, 4.$$

Описанная схема полностью позволяет определить поле в рассматриваемой слоистой структуре при плоских колебаниях. В общем случае колебания, возбуждаемые падающей гармонической волной **u**_{inc}, находятся в форме обратного преобразования Фурье

$$\mathbf{u}(x,z) = \mathbf{u}_{inc}(x,z)H(-z) + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{G}(\alpha,z)\mathbf{P}_{0}(\alpha) \, d\alpha. \quad (2.7)$$

Здесь H(z) — функция Хевисайда; $\mathbf{G}(\alpha, z)$ матрица 2 × 2, составленная из векторстолбцов \mathbf{U}_L и \mathbf{U}_T , являющихся решениями алгоритма (2.2)–(2.6) для $\delta_L = 1$, $\delta_T = 0$ и $\delta_L = 0$, $\delta_T = 1$ соответственно. Вектор $\mathbf{P}_0 = \{\Phi_{inc}(\alpha, 0), \Psi_{inc}(\alpha, 0)\}$ описывает источник колебаний на нижней границе фононного кристалла, где Φ_{inc} и Ψ_{inc} — преобразования Фурье продольных и поперечных потенциалов падающего поля.

2.3. Запрещенные и разрешенные зоны

Возможно наиболее интересным феноменом, возникающим в фононных кристаллах, являются запрещенные зоны. Запрещенные частотные зоны (ЗЧЗ) — это диапазоны частот, в которых распространение волн и волновой энергии через упругую структуру невозможно. Все другие диапазоны, в которых наблюдается прохождение, называются разрешенными зонами (РЧЗ).

Поиск запрещенных зон может быть осуществлен непосредственным численным анализом коэффициента прохождения. Однако существует более простой и точный подход, основанный на полученном полуаналитическом представлении (2.5).

Пусть для простоты описания собственные значения λ_1 и λ_2 матрицы \mathbf{T}_c выбраны так, чтобы $|\lambda_2| \ge |\lambda_1| \ge 1$. Тогда из (2.5) при $N \to \infty$ имеем следующую асимптотику:

$$\mathbf{x}_{t} = \{t_{L}, t_{T}\} \sim \\ \sim (\mathbf{m}_{1}\lambda_{2}^{-N} + \mathbf{m}_{2}\lambda_{1}^{-N})/(\Delta_{12}\lambda_{1}^{2N} + \Delta_{23})$$

при $N \to \infty$.

которая приводит к трем различным ситуациям, когда $|\mathbf{x}_t| \ll 1$, показанным в таблице. В последнем столбце таблицы приводится асимптотика энергетического коэффициента прохождения κ^+ .

Представленная классификация запрещенных зон с использованием собственных значений согласуется с методом, описанным

T	0- <i>E</i>	Π	Π+
Тип	Сооственные	дополнительные	Поведение к
зоны	значения T_c	условия	при $N \to \infty$
343 – I	$ \lambda_2 > 1 \&$	$\mathbf{m}_2 \neq 0 \& \Delta_{12} \neq 0$	$\kappa^+ = O(\lambda_1 ^{-2N})$
	$ \lambda_1 > 1$	$\mathbf{m}_2 = 0 \& \Delta_{12} \neq 0$	$\kappa^+ = O(\lambda_2 ^{-2N})$
3ЧЗ –II	$ \lambda_2 > 1$ &	$\mathbf{m}_2 = 0$	$\kappa^+ = O(\lambda_2 ^{-2N})$
	$ \lambda_1 = 1$		
РЗМП	$ \lambda_2 > 1 \&$	$0 < w < \varepsilon < 1$	$\kappa^+ = O(w ^2)$
	$ \lambda_1 = 1$	$w = \mathbf{m}_2/(\Delta_{12} + \Delta_{23}\lambda_1^{-2N}) $	
РЧЗ	$ \lambda_2 > 1 \&$		
	$ \lambda_1 = 1$	$w > \varepsilon$	$\kappa^+ = O(1)$
	или $ \lambda_2 = 1$		

Классификация частотных диапазонов возбуждения фононных кристаллов

в работе [15] и основанном на анализе коэффициентов локализации, которые определяются как наименьшее положительное значение показателя Ляпунова. Но здесь классификация получается естественным путем через анализ явного вида асимптотики поля при $N \to \infty$, кроме того, представленная классификация вводит понятие разрешенной зоны с малым прохождением *РЗМП*, в котором коэффициент прохождения настолько мал, что эти диапазоны можно в приближении рассматривать как запрещенные и использовать в приложениях.

3. Исследование фильтрационных свойств фононных кристаллов

Ниже приводятся результаты анализа влияния относительных толщин слоев ячейки (концентрации материалов), угла падения и типа падающей волны на волновые процессы в рассматриваемой слоистой структуре. В качестве материала A рассматривается оксид алюминия ($\rho = 4000 \text{ кг/м}^3$, E = 400гпа, $\nu = 0,231$). Материал B — алюминий ($\rho = 2700 \text{ кг/м}^3$, E = 70 гпа, $\nu = 0,33$) является более мягким, чем A.

Для демонстрации изменения запрещенных и разрешенных зон с вариацией толщин слоев A и B при фиксированной толщине ячейки $H = h_A + h_B$ на рис. 2 приводятся диаграммы запрещенных зон: по оси абсцисс изменяется отношение $K = h_A/h_B$ между толщинами, по оси ординат — частота колебаний. Для обозначения различных областей принимаются следующие соглашения: незакрашенные области соответствуют разрешенным зонам, области с градиентной заливкой обозначают запрещенные зоны I типа (ЗЧД-І), заштрихованные области с градиентной заливкой — зоны II типа (ЗЧД-II), тогда как РДМП обозначаются только штриховкой. Насыщенность цвета для зон I или II типов приводится в соответствии со значением коэффициента локализации γ , где $\gamma = \lg \lambda_1$ в случае ЗЧД-I или $\gamma = \lg \lambda_2$ в случае ЗЧД-II. Колебания в рассматриваемой структуре возбуждаются падающей под различными углами ($\theta = 0^{\circ}, \theta = 10^{\circ}, \theta = 60^{\circ}$ и $\theta = 80^{\circ}$) плоской Р-волны (рис. 2а–2г соответственно). С отклонением угла падения Р-волны от вертикального ($\theta = 0^{\circ}$) запрещенные зоны II типа исчезают, трансформируются в разрешенные частотные зоны малого прохождения (РЗМП). С увеличением угла падения Р-волны максимум коэффициента локализации среди всех запрещенных зон уменьшается, однако, при этом РЗМП, напротив, расширяются.

Местоположение, форма и ширина запрещенных зон и РДМП сильно изменяются внутри диапазона $10^{-1} < K < 10$. С увеличением частоты колебаний увеличивается и частота возникновения различных зон, которые с увеличением концентрации одного из материалов становятся более узкими. При $K \to 0$ или $K \to \infty$ коэффициент локализации в зонах стремится к нулю, так как среда становится однородной. С увеличением концентрации жесткого материала (A) запрещенные зоны смещаются в более высокие частотные диапазоны. Стоит отметить, что для всех приведенных углов падения при достаточно большой концентрации жесткого материала A (K > 10) запрещенные зоны являются более широкими, чем при большей концентрации мягкого материала ($K < 10^{-1}$).



Рис. 2. Зависимость запрещенных зон от отношения толщин слоев ячейки фононного кристалла

Присутствие мягкого материала B даже в малых концентрациях ($h_A = 100h_B$) приводит к появлению широких низкочастотных запрещенных зон в квазипериодической упругой структуре.

Литература

- Kushwaha M.S., Halevi P., Dobrzynski L., Djafari-Rouhani B. Acoustic band structure of periodic elastic composites // Physics Review Letters, 1993. Vol. 71. P. 2022–2025.
- Bilal O. R., Hussein M. I. Ultrawide phononic band gap for combined in-plane and outof-plane waves // Physical Review E, 2011. Vol. 84. P. 065701.

- Matar O. B., Robillard J. F., Vasseur J. O. et al. Band gap tunability of magneto-elastic phononic crystal // Journal of Applied Physics, 2012. Vol. 111. No. 5. P. 054901.
- Swinteck N., Bringuier S., Robillard J.-F. et al. Phase-control in two-dimensional phononic crystals // Journal of Applied Physics, 2011. Vol. 110. No. 7. P. 074507.
- Goffaux C., Vigneron J. P. Theoretical study of a tunable phononic band gap system // Physical Review B, 2001. Vol. 64. P. 075118.
- 6. Yeh J. Y., Chen L. W. Wave propagations of a periodic sandwich beam by FEM and the transfer matrix method // Composite Structures, 2006. Vol. 73. P. 53–60.
- 7. Cao Y. J., Hou Z. L., Liu Y. Y. Finite difference time domain method for band gap calculations

of two-dimensional phononic crystals // Solid State Communications, 2004. Vol. 132. P. 539–543.

- Golub M. V., Zhang Ch., Wang Y.-S. SH-wave propagation and resonance phenomena in a periodically layered composite structure with a crack // Journal of Sound and Vibration, 2011. Vol. 330. No. 13. P. 3141–3154.
- Liu Y., Gao L. T. Explicit dynamic finite element method for band-structure calculations of 2D phononic crystals // Solid State Communications, 2007. Vol. 144. P. 89–93.
- Бабешко В.А., Глушков Е.В., Зинченко Ж. Ф. Динамика неоднородных линейноупругих сред. М.: Наука, 1989. 344 с.
- Глушков Е.В., Глушкова Н.В., Еремин А.А., Михаськив В.В. Метод слоистых элементов в динамической теории упругости // Прикладная математика и механика, 2009.

T. 73. № 4. C. 622–634.

- Глушков Е. В., Глушкова Н. В., Фоменко С. И., Жанг Ч. Поверхностные волны в материалах с функционально-градиентными покрытиями // Акустический журнал, 2012. Т. 58. № 2. С. 370–385.
- Golub M. V., Fomenko S. I., Bui T. Q. et al. Transmission and band gaps of elastic SH waves in functionally graded periodic laminates // International Journal of Solids and Structures, 2012. Vol. 49. No. 2. P. 344–354.
- Aki K., Richards P. G. Quantitative Seismology. University Science Books, 2002. P. 704.
- Castanier M. P., Pierre C. Lyapunov exponents and localization phenomena in multi-coupled nearly periodic systems // Journal of Sound and Vibration, 1995. Vol. 183. No. 3. P. 493– 515.

Ключевые слова: упругие колебания, фононный кристалл, метод Т-матриц, запрещенная зона, разрешенная зона малого прохождения.

Статья поступила 30 сентября 2013 г.

Институт математики, механики и информатики Кубанского государственного университета, г. Краснодар © Фоменко С.И., 2013